

|                 |  |
|-----------------|--|
| 認定プログラムの名称      | JCSS（国際 MRA 対応）  |
| 認定識別            | JCSS 0184 Calibration  |
| 認定された適合性評価機関の名称 | 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター   |
| 法人の名称           | 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター<br>法人番号 6010605002434                   |
| 問い合わせ窓口         | 技術支援部 実証試験技術グループ<br>TEL : 03-5530-2193      FAX : 03-5530-2318 |



20230821評基第007号  
2024年2月4日

## 認 定 証

独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センターは、以下の適合性評価機関を JCSS 認定プログラムの校正事業者として認定する。

認 定 識 別: JCSS 0184 Calibration

適合性評価機関の名称: 地方独立行政法人

東京都立産業技術研究センター

法 人 の 名 称: 同上

適合性評価機関の所在地: 東京都江東区青海二丁目4番10号

認 定 範 囲: 長さ、温度、電気（直流・低周波）  
（詳細は別紙のとおり）

認定要求事項: ISO/IEC 17025:2017

認定スキーム文書（JCSS 認定）に記載した  
認定要求事項

認 定 発 効 日: 2024年2月4日

認定の有効期限: 2028年2月3日

初回認定発効日: 2013年8月1日

独立行政法人製品評価技術基盤機構

認定センター所長 齊藤 和則

- ・ IAJapan(独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センター)は、ILAC(国際試験所認定協力機構)及び APAC(アジア太平洋認定協力機構)のMRA(相互承認取決め)に署名している認定機関です。
- ・ 相互承認取決めに係る要求事項は、認定の基準（該当する国際規格）適合義務の他に、技能試験参加要件及び定期的な審査の受審並びにMRA対応事業者に対するトレーサビリティ要求事項（方針）を指します。
- ・ この事業者は ISO/IEC 17025:2017 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項に適合しています。この認定は当該事業者が認定された範囲において一貫して技術的に有効な試験結果及び校正を提供するために必要な技術能力要求事項及びマネジメントシステム要求事項を満たしていることを証明するものです（2017年4月 ISO-ILAC-IAF 共同コミュニケ参照）。
- ・ IAJapan ウェブサイトで公開している認定証が最新の認定情報です。

登録（認定）に係る区分：長さ

法律に基づく初回登録年月日：2015 年 6 月 12 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：2015 年 6 月 12 日

校正手法の区分の呼称〔登録更新（認定発効）年月日〕：一次元寸法測定器、形状測定器〔2024 年 2 月 4 日〕

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

| 校正手法の<br>区分の呼称# | 種類                                       |                          | 校正範囲                | 拡張不確かさ<br>(信頼の水準約 95 %) |
|-----------------|--|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| 一次元寸法測定器        | ノギス                                      |                          | 600 mm 以下           | 0.02 mm                 |
|                 | マイクロメータ                                  |                          | 25 mm 以下            | 0.5 μm                  |
|                 |  |                          | 25 mm 超 100 mm 以下   | 2 μm                    |
|                 | ダイヤルゲージ                                  |                          | 5 mm 以下             | 0.7 μm                  |
|                 |  |                          | 10 mm 以下            | 0.5 μm                  |
|                 |  |                          | 5 mm 超 50.8 mm 以下   | 1.4 μm                  |
|                 |  |                          | 50.8 mm 超 100 mm 以下 | 2.3 μm                  |
|                 | ダイヤルゲージ                                  |                          | 100 mm 以下           | 1.6 μm                  |
|                 |  |                          | 1.6 mm 以下           | 1.1 μm                  |
|                 |  |                          | 6 mm 以上 400 mm 以下   | 1.3 μm                  |
|                 |  |                          | 300 mm 以下           | 0.02 mm                 |
|                 | デプスゲージ                                   |                          | 1000 mm 以下          | 0.014 mm                |
|                 |  |                          | 25 mm 以下            | 0.3 μm                  |
|                 | ダイヤルゲージ校正器                               |                          | 10 mm 以下            | 0.15 μm                 |
|                 |  |                          | 10 mm 超 100 mm 以下   | 0.40 μm                 |
|                 | 伸び計校正器                                   |                          | 0.5 mm 以上 100 mm 以下 | 0.11 μm                 |
|                 |  |                          | 100 mm 超 250 mm 以下  | 0.20 μm                 |
|                 | ブロックゲージ<br>(比較測定法による)                    |                          | 310 mm 以下           | 0.6 μm                  |
|                 |  |                          | 310 mm 超 610 mm 以下  | 0.8 μm                  |
|                 |  |                          | 610 mm 超 1010 mm 以下 | 1.1 μm                  |
|                 | 各種長さ測定用校正器で<br>測定面が平面であるもの<br>(比較測定法による) |                          | 10 mm 以上 200 mm 以下  | 0.5 μm                  |
|                 |  |                          | 1 mm 以上 200 mm 以下   | 0.6 μm                  |
| 形状測定器           | 座標測定機用<br>ゲージ                            | 寸法、距離、<br>座標又は最小<br>二乗直径 | 200 mm 以下           | 0.3 μm                  |
|                 |  |                          | 310 mm 以下           | 0.6 μm                  |
|                 |  |                          | 310 mm 超 1010 mm 以下 | 0.7 μm                  |
|                 |  | 幾何偏差                     | 10 μm 以下            | 0.3 μm                  |
|                 | 球  | 平均直径                     | 5 mm 以上 15 mm 以下    | 0.08 μm                 |
|                 |  |                          | 15 mm 超 30 mm 以下    | 0.09 μm                 |

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

登録（認定）に係る区分：温度  
法律に基づく初回登録年月日：2008 年 9 月 10 日  
国際 MRA 対応初回認定発効日：2013 年 8 月 1 日  
校正手法の区分の呼称 [登録更新（認定発効）年月日]：接触式温度計 [2024 年 2 月 4 日]  
恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正  
校正測定能力

| 校正手法の<br>区分の呼称# | 種類         | 校正範囲                 | 拡張不確かさ<br>(信頼の水準約 95 %) |
|-----------------|------------|----------------------|-------------------------|
| 接触式温度計          | 熱電対（比較校正法） | 200 °C 以上 1000 °C 以下 | 1.8 °C                  |

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

登録（認定）に係る区分：電気（直流・低周波）  
法律に基づく初回登録年月日：2006 年 12 月 27 日  
国際 MRA 対応初回認定発効日：2013 年 8 月 1 日  
校正手法の区分の呼称 [登録更新（認定発効）年月日]：直流・低周波測定器等 [2024 年 2 月 4 日]  
恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正  
校正測定能力

| 校正手法の<br>区分の呼称# | 種類       | 校正範囲               |                    | 拡張不確かさ<br>(信頼の水準約 95 %) |
|-----------------|----------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 直流・低周波測定器等      | 直流抵抗器    | 1 Ω                |                    | 1.1 ppm                 |
|                 |          | 10 Ω               |                    | 1.7 ppm                 |
|                 |          | 100 Ω              |                    | 1.3 ppm                 |
|                 |          | 1 kΩ               |                    | 1.8 ppm                 |
|                 |          | 10 kΩ              |                    | 1.6 ppm                 |
|                 |          | 100 kΩ             |                    | 2.3 ppm                 |
|                 | 直流電圧測定装置 | 0 mV 以上 110 mV 以下  |                    | 3.3 μV                  |
|                 |          | 110 mV 超 1000 V 以下 |                    | 8.5 ppm                 |
|                 | 交流電圧測定装置 | 50 Hz              | 10 mV 以上 220 mV 以下 | 0.011 mV                |
|                 |          | 50 Hz              | 220 mV 超 1000 V 以下 | 0.0065 %                |
|                 | 直流電流測定装置 | 0 μA 以上 110 μA 以下  |                    | 0.013 μA                |
|                 |          | 110 μA 超 11 A 以下   |                    | 0.013 %                 |
|                 |          | 11 A 超 30 A 以下     |                    | 0.15 %                  |
|                 | 交流電流測定装置 | 50 Hz              | 0.1 mA 以上 11 A 以下  | 0.061 %                 |
|                 |          | 50 Hz              | 11 A 超 50 A 以下     | 0.15 %                  |

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。